## DE 100 47 963 A 1

23

.

andere Bauteilschicht im Schritt des Verbindens an einem anderen klebenden Substrat als dem Halbleitersubstrat befestigt wird.

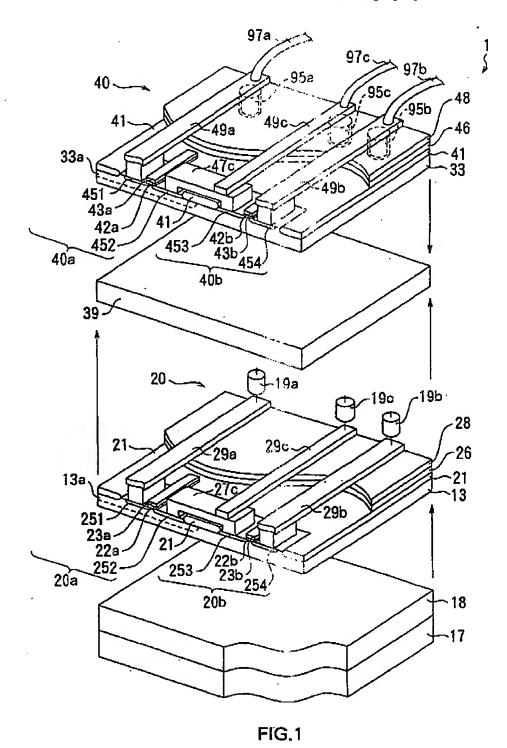
- 16. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Halbleitersubstrat (11) aus Silicium (Si) 5 oder Germanium (Ge) hergestellt wird,
- 17. Verfahren nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteilschicht (20, 40) durch epitaktisches oder heteroepitaktisches Wachstum auf dem Halbleitersubstrat (11) hergestellt wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet. dass im Schritt des Verbindens der Bauteileinheit zwei Bauteileinheiten (2, 4) unter Verwendung eines Klebers aneinander befestigt werden.
- 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 15 zeichnet, dass ein Kleber aus isolierendem Material verwendet wird.
- 20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trägersubstrat mit Durchgangslöchern verwendet wird, die ein Flussmittel zum Lösen 20 des Klebers hindurchtreten lassen.
- 21. Verfahren nach Anspruch 18. dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber in einen vorgegehenen Raum auf der der Bauteilschicht zugewandten Seite des Trägersubstrats eingebracht wird.
- 22. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Bauteilschichten auf einem Trägersubstrat aufgebracht werden.
- 23. Verfahren zum Herstellen eines Dünnfilm-Bauteils mit mehreren Bauteilschichten, mit den folgenden 30 Schritten:
  - Herstellen einer internen Isolierschicht (130) aus einem isolierenden Material in einer Halbleiterschicht (13) mit einem Paar Oberflächen;
  - Herstellen einer ersten Bauteilschicht (20) auf 35 einer Seite der Halbleiterschicht und
  - Herstellen einer zweiten Bauteilschicht (40) auf der anderen Seite der Halbleiterschicht.
- 24. Verfahren nach Anspruch 23. dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Herstellens der internen 40 Isolierschicht (130) Ionen in die Halbleiterschicht (13) implantiert werden.
- 25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht (13) auf einem eine poröse Schicht einbettenden Halbleitersubstrat hergestellt wird.
- 26. Verfabren nach Anspruch 25. dadurch gekennzeichnet, dass die poröse Schicht durch Anodisieren auf dem Halbleitersubstrat hergestellt wird.
- 27. Verfahren nach Anspruch 23. dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht durch epitakrisches Wachstum auf dem Halbleitersubstrat hergestellt wird. 28. Dünnfilm-Bauteil mit mehreren Bauteilschichten (20, 40), das eine Licht emittierende Bauteilschicht (80) und eine Licht empfangende Fotodetektorschicht 55 (50) aufweist.
- 29. Dünnfilm-Bauteil nach Anspruch 28. dadurch gekennzeichnet, dass die Licht emittierende Bauteilschicht (50) unter Verwendung eines Klebers an der Fotodetektorschicht (80) be(estigt wird.
- 30. Dünnfilm-Bauteil nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht ernittierende Bauteilschicht (50) so hergestellt wird, dass sie Licht im Wesentlichen rechtwinklig zu einer Oberfläche emittiert.

Hierzu 24 Scite(n) Zeichnungen

24

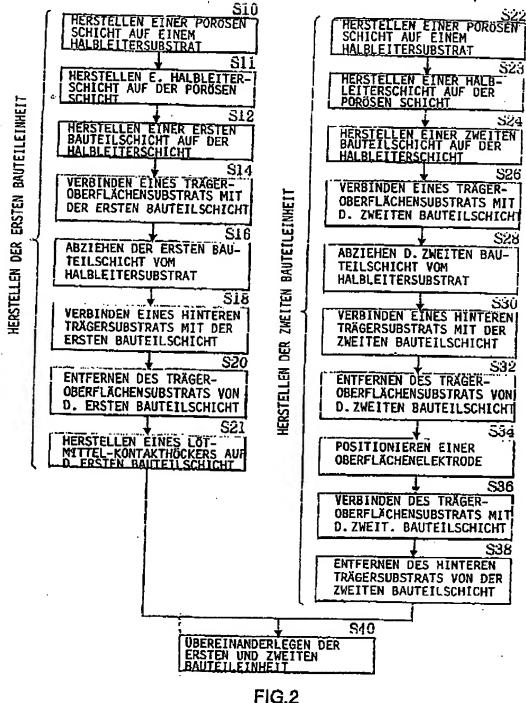
- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.': Offenlegungsteg: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001





DE 100 47,963 A1 H 01 L 25/04 29. Mārz 2001

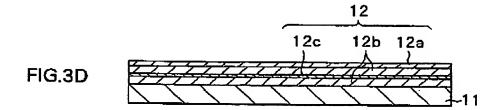


Nummer: Int. Cl.<sup>2</sup>; Offenlegungstag:



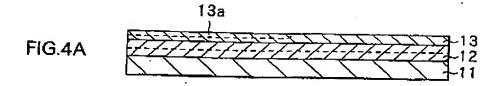


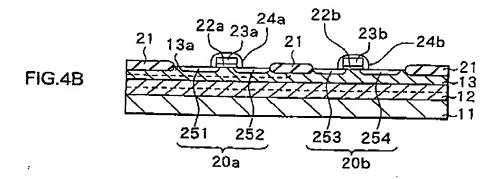


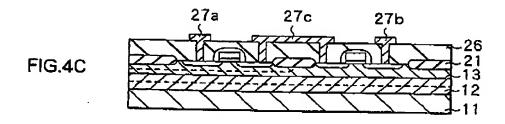


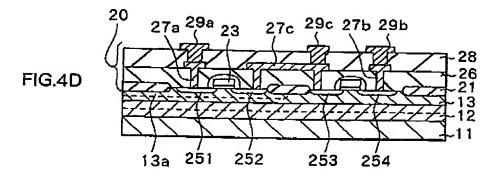


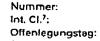
DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001







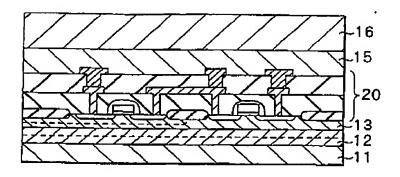




DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. Mārz 2001



7814019966 .





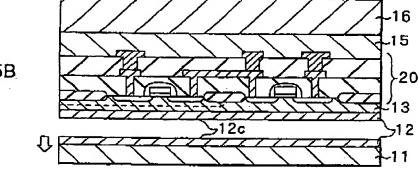
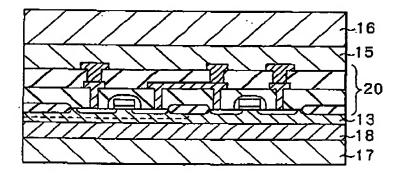
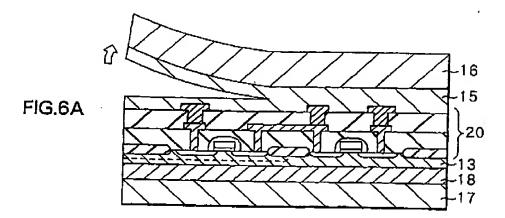
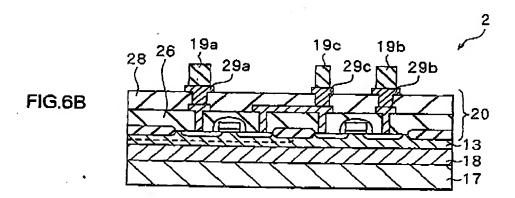


FIG.5C

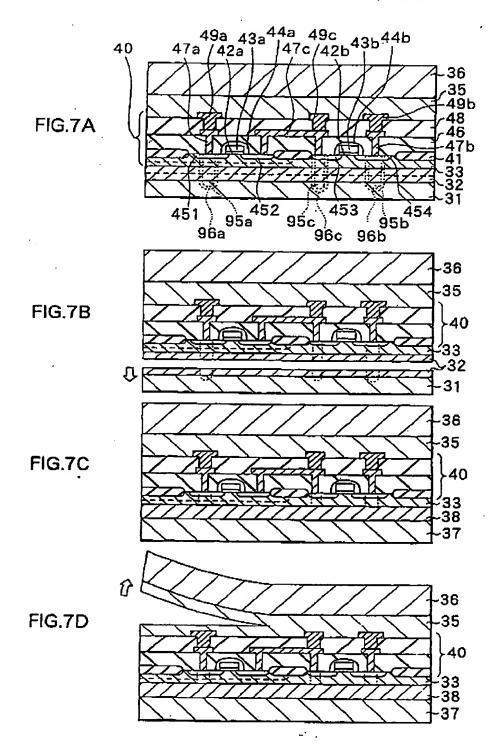


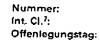
Nummer; Int. Cl.<sup>7</sup>; Offenlegungsteg:



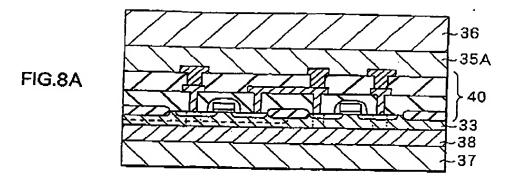


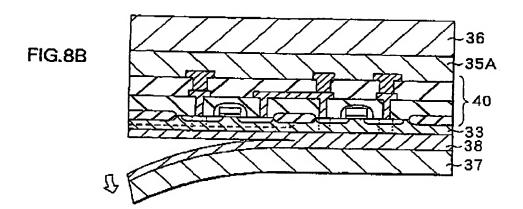
Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag:

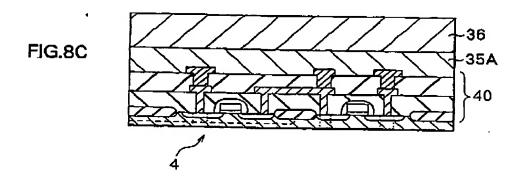


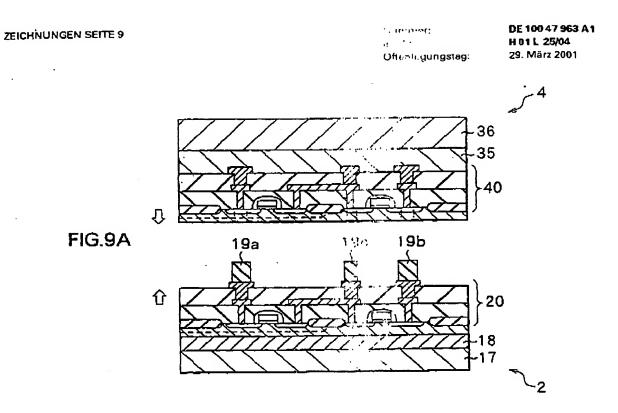


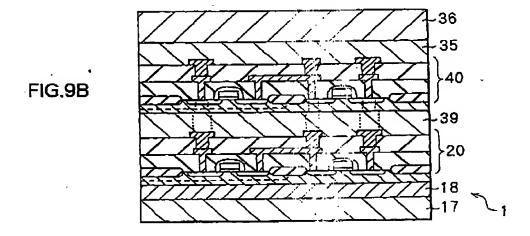
DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001







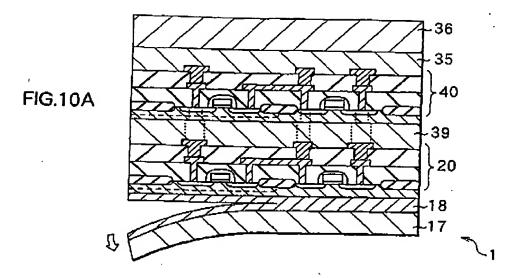


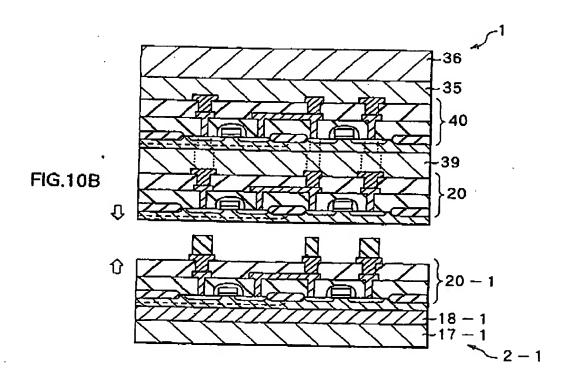




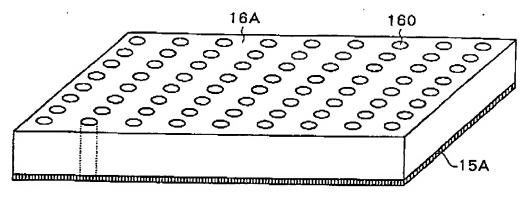


DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001





Nummer: Int. Cl.<sup>3</sup>: Offenlegungstag:



**FIG.11** 

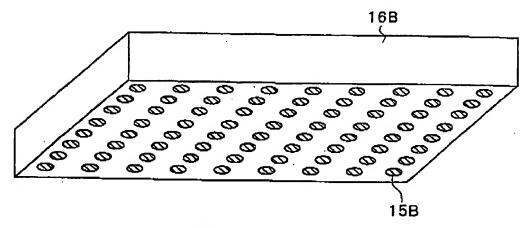
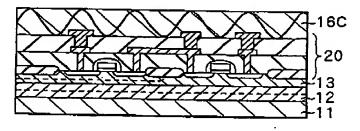


FIG.12



**FIG.13** 



Nummer: Int. Cl.<sup>2</sup>: Offenlegungstag:

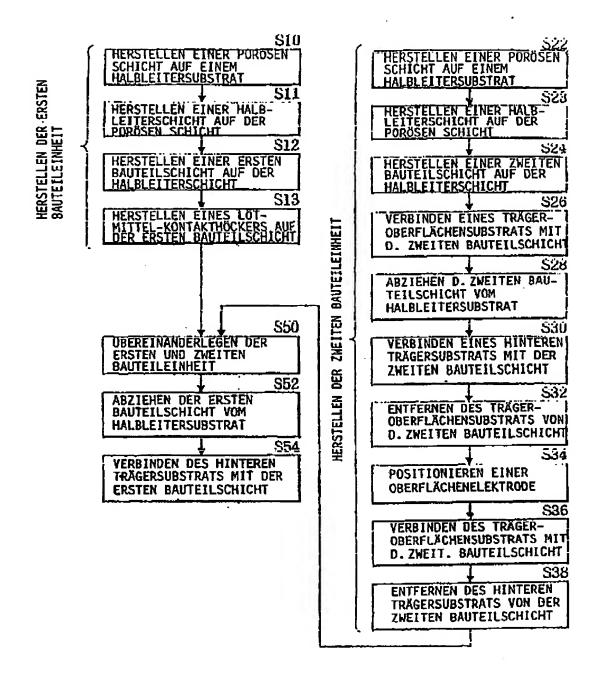
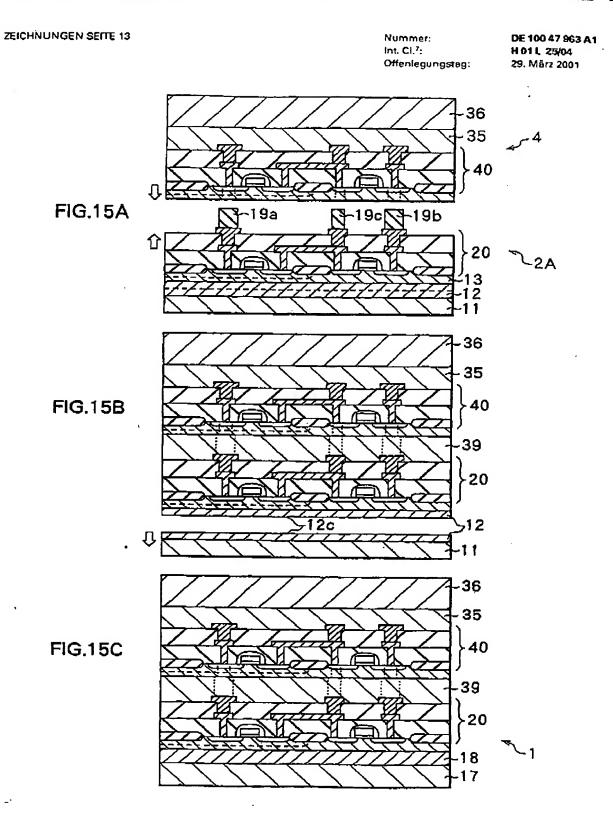


FIG.14



Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>; Offenlegungsteg:

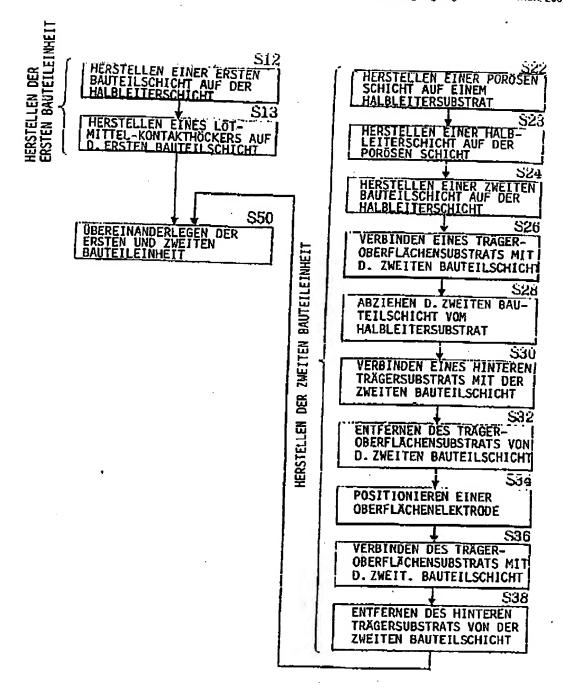
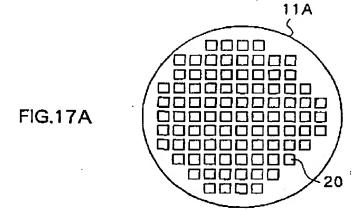
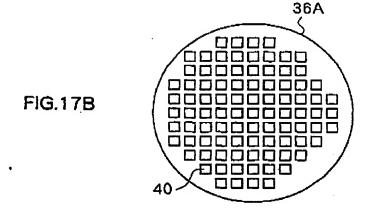


FIG.16

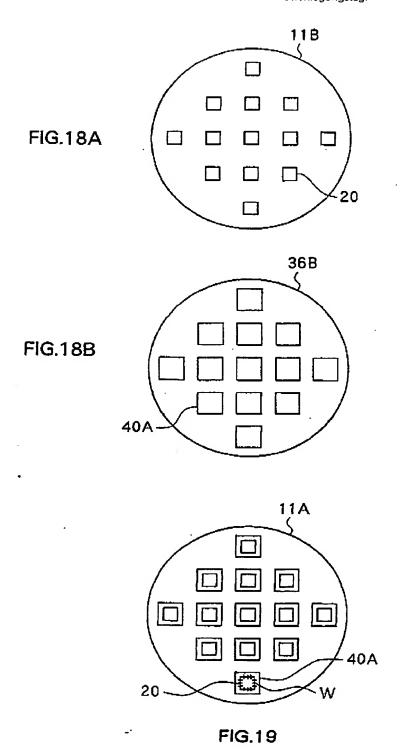
Nummer: Int. Cl.<sup>3</sup>: Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001





Nummer: Int. Cl./: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001



J

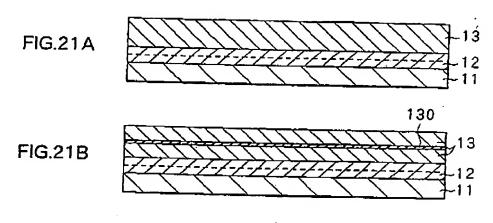
ZEICHNUNGEN SEITE 17

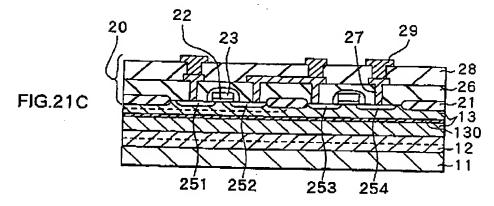
Nummer: Int. Cl./; Offenlegungstag:

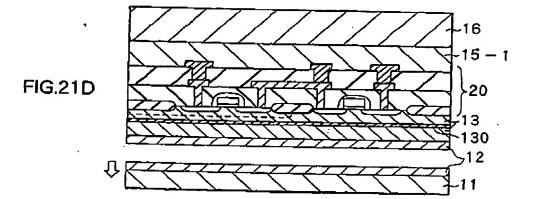


FIG.20

Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag:







Nummer: Int. Cl.':

Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001

FIG.22A

7814019966

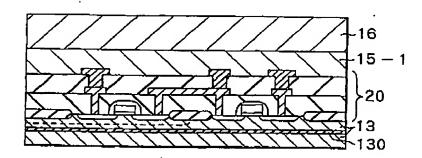
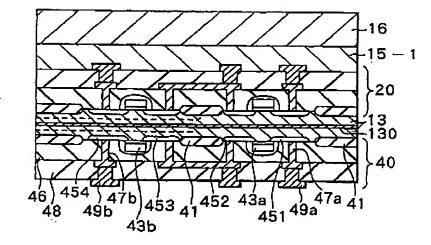


FIG.22B



Nummer: Int. Cl./:

Offenlegungstag:



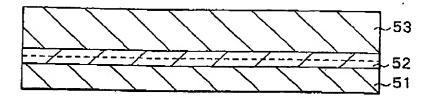


FIG.23B

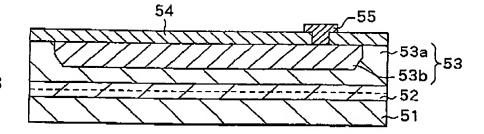


FIG.23C

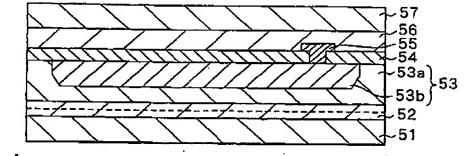
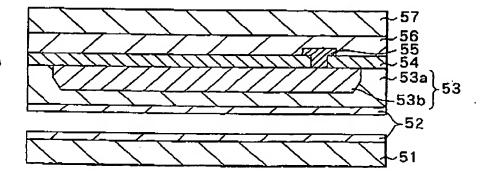
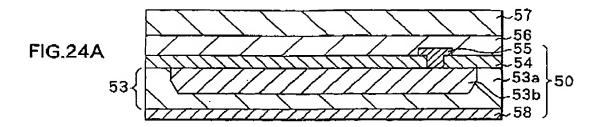
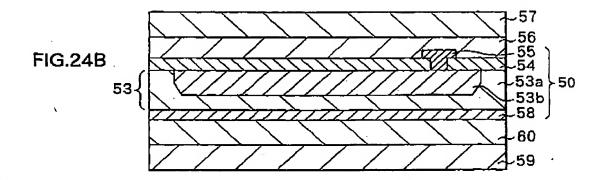


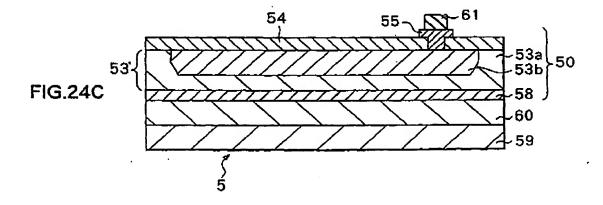
FIG.23D



Nummer: Int, CI.7: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001



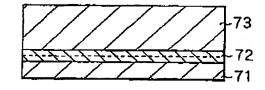




Nummer: Int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. Mārz 2001



7814019966



## FIG.25B

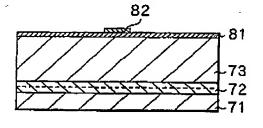


FIG.25C

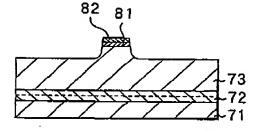


FIG.25D

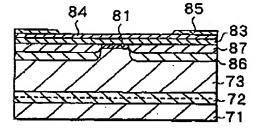
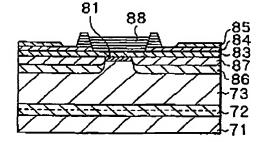
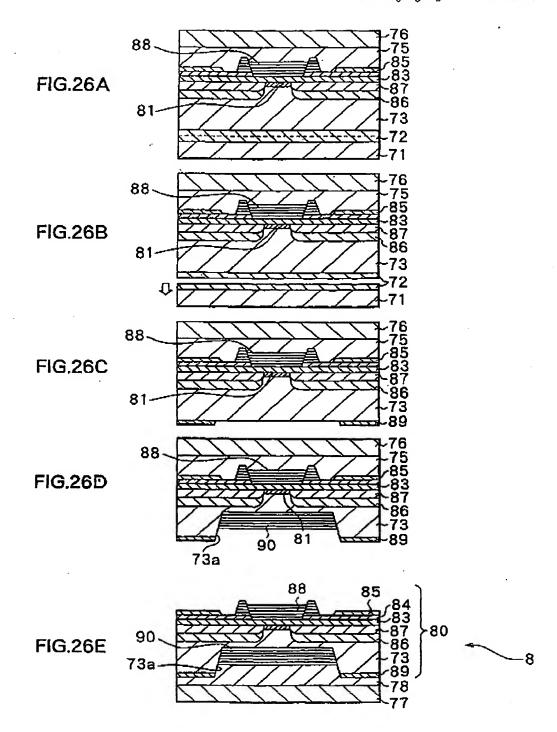


FIG.25E



7814019966

Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag:



Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag: DE 100 47 963 Å1 H 01 L 25/04 29. März 2001

